

Capteurs sans batterie ou le mythe de l'autonomie infinie

*Comment la variabilité et le vieillissement des composants impacte
l'exécution de programmes ?*

Hugo Reymond - Equipe PACAP
Greendays 2025

Capteurs sans fil

Capteurs sans fil

- Collecte de données, traitement et envoi des données

Capteurs sans fil

- Collecte de données, traitement et envoi des données
- Déploiement dans des lieux souvent isolés ou inaccessibles

Capteurs sans fil

- Collecte de données, traitement et envoi des données
- Déploiement dans des lieux souvent isolés ou inaccessibles

Autonomie des capteurs sans fil

Capteurs sans fil

- Collecte de données, traitement et envoi des données
- Déploiement dans des lieux souvent isolés ou inaccessibles

Autonomie des capteurs sans fil

Piles et batteries

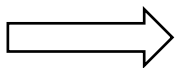


Capteurs sans fil

- Collecte de données, traitement et envoi des données
- Déploiement dans des lieux souvent isolés ou inaccessibles

Autonomie des capteurs sans fil

Piles et batteries



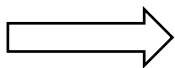
- Autonomie limitée, remplacement fréquent
- Beaucoup de déchets

Capteurs sans fil

- Collecte de données, traitement et envoi des données
- Déploiement dans des lieux souvent isolés ou inaccessibles

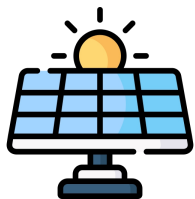
Autonomie des capteurs sans fil

Piles et batteries



- Autonomie limitée, remplacement fréquent
- Beaucoup de déchets

Récolte d'énergie

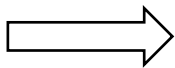


Capteurs sans fil

- Collecte de données, traitement et envoi des données
- Déploiement dans des lieux souvent isolés ou inaccessibles

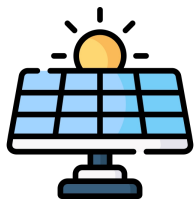
Autonomie des capteurs sans fil

Piles et batteries



- Autonomie limitée, remplacement fréquent
- Beaucoup de déchets

Récolte d'énergie



Condensateur

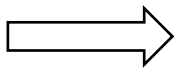


Capteurs sans fil

- Collecte de données, traitement et envoi des données
- Déploiement dans des lieux souvent isolés ou inaccessibles

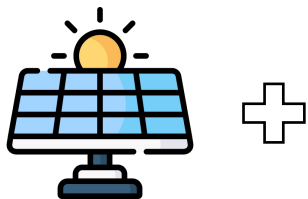
Autonomie des capteurs sans fil

Piles et batteries

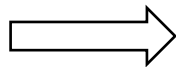


- Autonomie limitée, remplacement fréquent
- Beaucoup de déchets

Récolte d'énergie



Condensateur



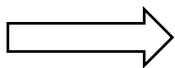
- Autonomie "infinie"
- Empreinte écologique réduite

Capteurs sans fil

- Collecte de données, traitement et envoi des données
- Déploiement dans des lieux souvent isolés ou inaccessibles

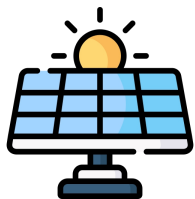
Autonomie des capteurs sans fil

Piles et batteries

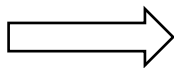


- Autonomie limitée, remplacement fréquent
- Beaucoup de déchets

Récolte d'énergie



Condensateur



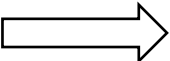
- Autonomie "infinie"
- Empreinte écologique réduite

Comment cette autonomie "infinie" se confronte aux réalités matérielles ?

Les caractéristiques des composants varient selon :

- Conditions d'opérations  
- Vieillessement des matériaux 

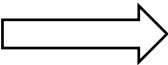
Exemple : Condensateur

 Vieillessement  Capacité réduite, Résistance série (ESR) augmentée

Les caractéristiques des composants varient selon :

- Conditions d'opérations  
- Vieillessement des matériaux 

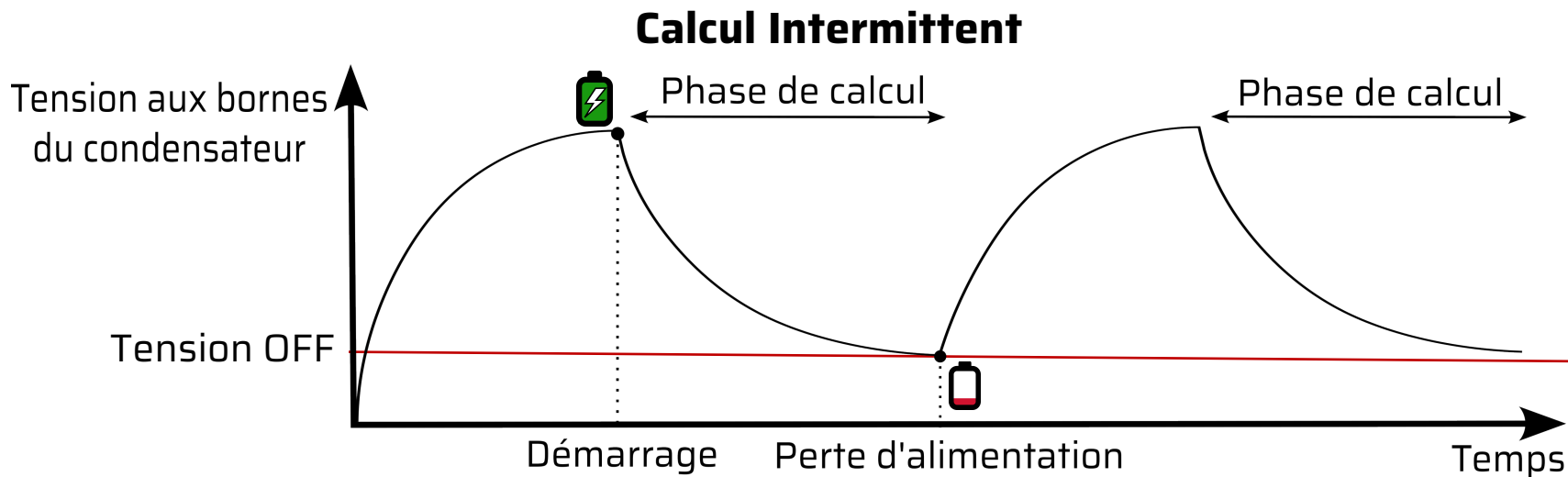
Exemple : Condensateur

 Vieillessement  Capacité réduite, Résistance série (ESR) augmentée

Quel est l'impact de cette variabilité sur l'exécution d'un programme ?

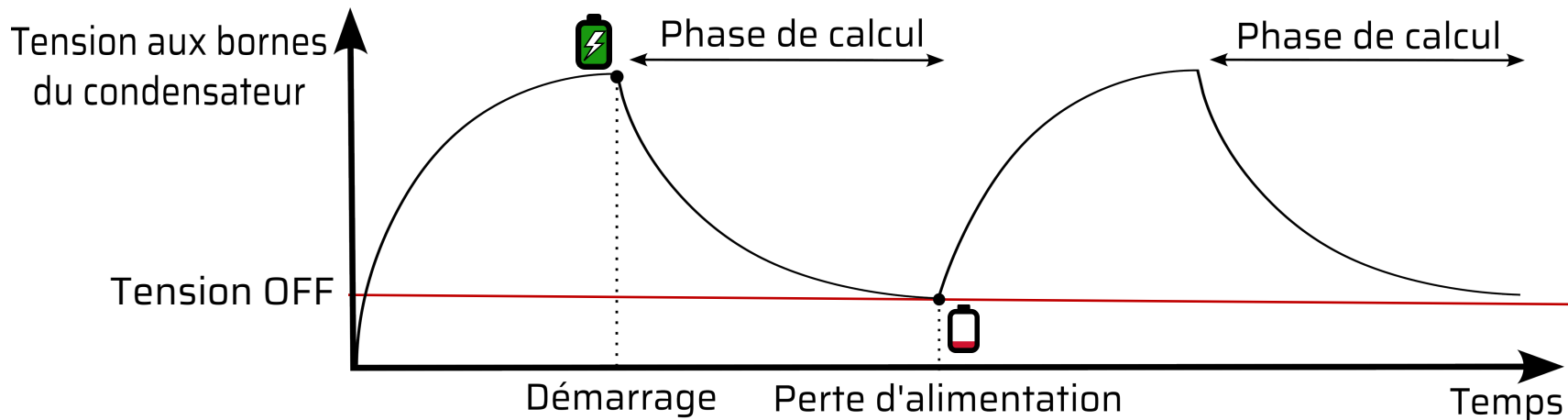
Absence de batteries + Faible énergie récoltée $\Rightarrow$ Calcul en continu impossible

Absence de batteries + Faible énergie récoltée $\Rightarrow$ Calcul en continu impossible



Absence de batteries + Faible énergie récoltée $\Rightarrow$ Calcul en continu impossible

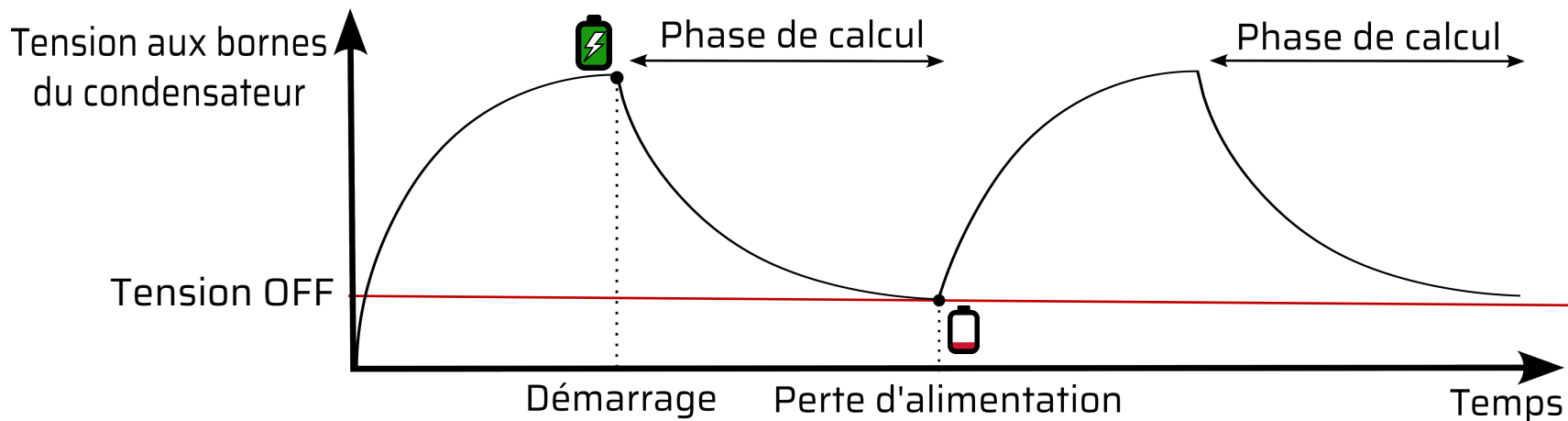
Calcul Intermittent



Perte d'alimentation

Absence de batteries + Faible énergie récoltée $\Rightarrow$ Calcul en continu impossible

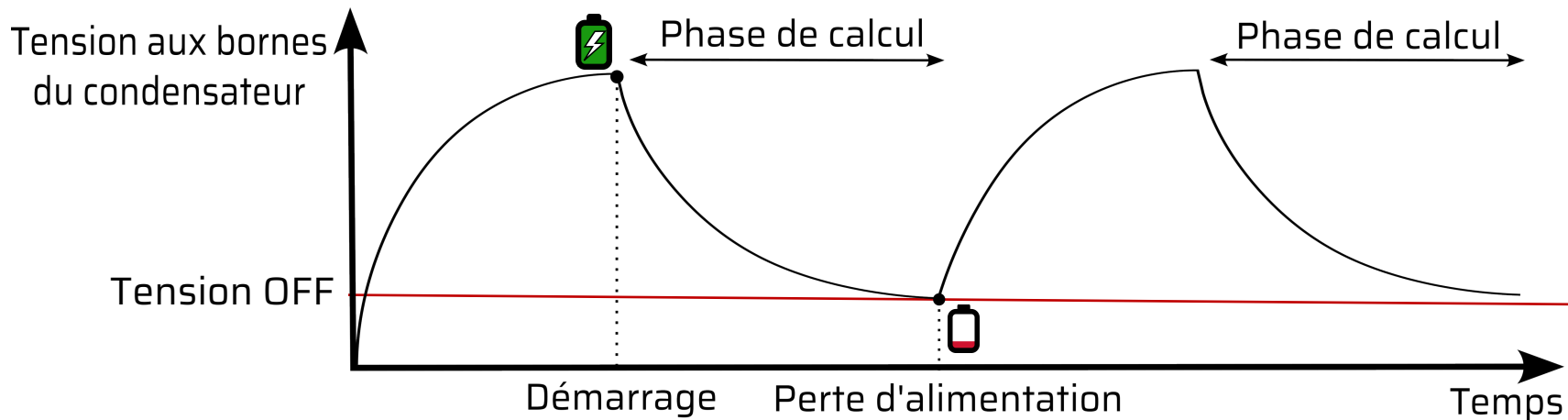
Calcul Intermittent



Perte d'alimentation $\Rightarrow$ Perte des données volatiles (mémoire et registres)

Absence de batteries + Faible énergie récoltée $\Rightarrow$ Calcul en continu impossible

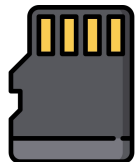
Calcul Intermittent



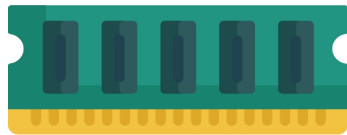
Perte d'alimentation $\Rightarrow$ Perte des données volatiles (mémoire et registres) $\Rightarrow$ Progression perdue



VM : Mémoire volatile



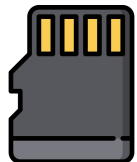
NVM : Mémoire
non volatile



VM : Mémoire volatile



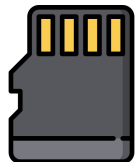
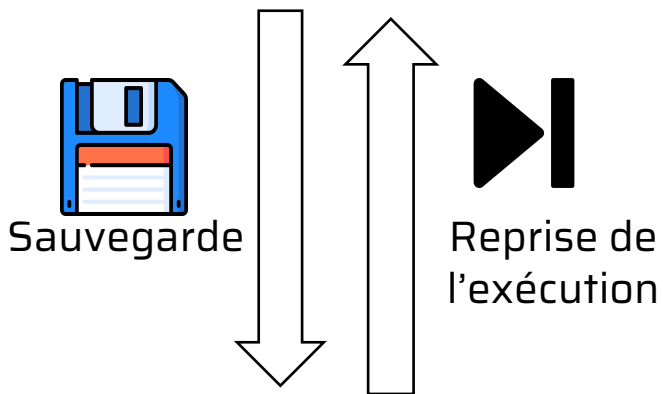
Sauvegarde



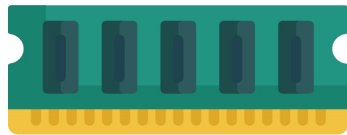
NVM : Mémoire
non volatile



VM : Mémoire volatile



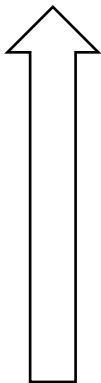
NVM : Mémoire non volatile



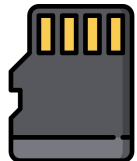
VM : Mémoire volatile



Sauvegarde



Reprise de
l'exécution

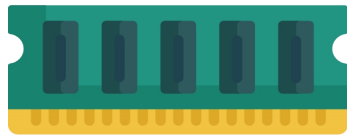


NVM : Mémoire
non volatile

```
int sum = 0;
for(int i = 0; i<4; i++){

    sum += array[i]
}

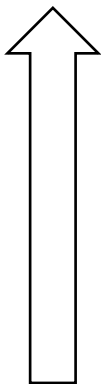
send(sum);
```



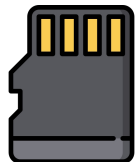
VM : Mémoire volatile



Sauvegarde



Reprise de
l'exécution



NVM : Mémoire
non volatile

```
int sum = 0;
for(int i = 0; i<4; i++){
    checkpoint();
    sum += array[i]
}
checkpoint();
send(sum);
checkpoint();
```

Placement de point de sauvegarde dimensionné par rapport à la
taille du condensateur

Placement de point de sauvegarde dimensionné par rapport à la taille du condensateur

```
int sum = 0;
for(int i = 0; i<4; i++){
    checkpoint();
    sum += array[i]
}
checkpoint();
send(sum);
checkpoint();
```



Placement de point de sauvegarde dimensionné par rapport à la taille du condensateur

```
int sum = 0;
for(int i = 0; i<4; i++){
    checkpoint();
    sum += array[i]
}
checkpoint();
send(sum);
checkpoint();
```



A diagram consisting of a green battery icon with a white lightning bolt inside. To the left of the battery is a vertical double-headed arrow, indicating a range or duration. This diagram is positioned to the right of the loop body in the code block above, specifically between the 'checkpoint()' and 'sum += array[i]' lines.

$$E = \frac{1}{2}CV^2$$

Placement de point de sauvegarde dimensionné par rapport à la taille du condensateur

```
int sum = 0;
for(int i = 0; i<4; i++){
    checkpoint();
    sum += array[i]
}
checkpoint();
send(sum);
checkpoint();
```



$$E = \frac{1}{2}CV^2$$

Si la capacité diminue, il devient impossible d'atteindre le prochain point de sauvegarde

Réexécution à l'infini : PLUS DE PROGRÈS

Placement de point de sauvegarde dimensionné par rapport à la taille du condensateur

```
int sum = 0;
for(int i = 0; i<4; i++){
    checkpoint();
    sum += array[i]
}
checkpoint();
send(sum);
checkpoint();
```



A vertical double-headed arrow is positioned to the right of the code block, spanning the height of the loop body. To the right of the arrow is a green battery icon with a white lightning bolt, symbolizing energy or a checkpoint.

$$E = \frac{1}{2}CV^2$$

Si la capacité diminue, il devient impossible d'atteindre le prochain point de sauvegarde

Réexécution à l'infini : PLUS DE PROGRÈS

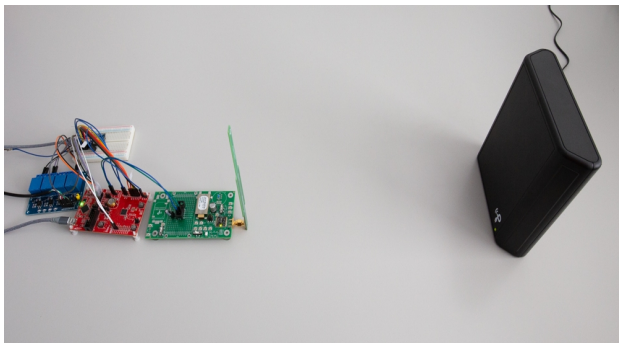
L'observe-t-on expérimentalement ?

Matériel

Noir : Source d'énergie (Émetteur RF)

Vert : Récolte d'énergie (P2110 RF harvester)

Rouge : Cible (Microcontrôleur MSP430FR5969)

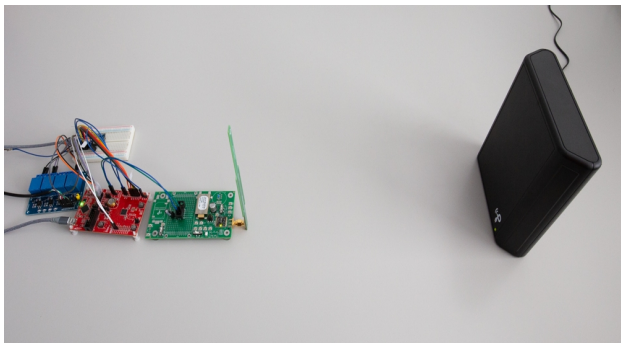


Matériel

Noir : Source d'énergie (Émetteur RF)

Vert : Récolte d'énergie (P2110 RF harvester)

Rouge : Cible (Microcontrôleur MSP430FR5969)



Logiciel

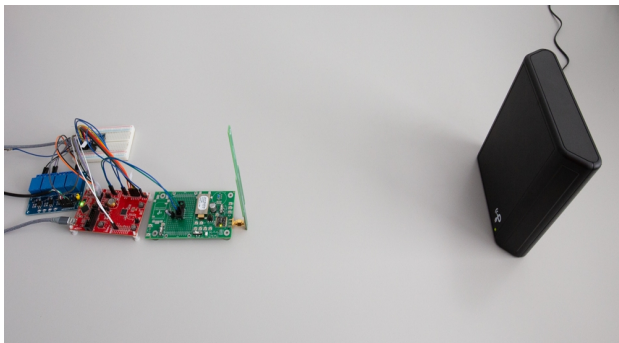
- Trois benchmarks (aes, crc, rc4)
- Placement de point de sauvegarde statique conservatif

Matériel

Noir : Source d'énergie (Émetteur RF)

Vert : Récolte d'énergie (P2110 RF harvester)

Rouge : Cible (Microcontrôleur MSP430FR5969)



Logiciel

- Trois benchmarks (aes, crc, rc4)
- Placement de point de sauvegarde statique conservatif

Réserve d'énergie

Capacité (en μF)	105	75	42	22
Dégradation	0%	29%	60%	80%



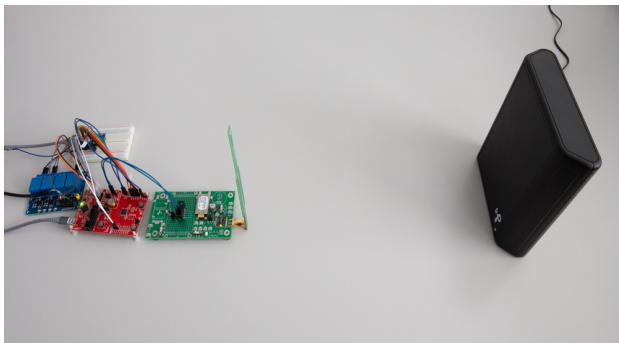
On ne simule pas la dégradation de l'ESR

Matériel

Noir : Source d'énergie (Émetteur RF)

Vert : Récolte d'énergie (P2110 RF harvester)

Rouge : Cible (Microcontrôleur MSP430FR5969)



Logiciel

- Trois benchmarks (aes, crc, rc4)
- Placement de point de sauvegarde statique conservatif

Réserve d'énergie

Capacité (en μF)	105	75	42	22
Dégradation	0%	29%	60%	80%



On ne simule pas la dégradation de l'ESR

Protocole

- La puissance récoltée ne permet pas d'alimenter la cible en continu
- La cible exécute un programme en boucle pendant 1 min
- On compte le nombre de programmes exécutés pendant les 1 min

	Benchmarks exécutés (moyenne)		
Capacité(μ F)	aes	crc	rc4
105	26	61	34
75	30	61	38
42	0	73	7
22	0	0	0

- Si le condensateur est trop dégradé, pas de progrès
 - Aucun benchmark complété

	Benchmarks exécutés (moyenne)		
Capacité(μ F)	aes	crc	rc4
105	26	61	34
75	30	61	38
42	0	73	7
22	0	0	0

	Pourcentage de réexécution		
Capacité(μ F)	aes	crc	rc4
105	0%	0%	0%
75	0%	0%	0%
42	96%	0%	95%
22	80%	99%	99%

- Si le condensateur est trop dégradé, pas de progrès
 - Aucun benchmark complété
 - Principalement de la réexécution

	Benchmarks exécutés (moyenne)		
Capacité(μ F)	aes	crc	rc4
105	26	61	34
75	30	61	38
42	0	73	7
22	0	0	0

	Pourcentage de réexécution		
Capacité(μ F)	aes	crc	rc4
105	0%	0%	0%
75	0%	0%	0%
42	96%	0%	95%
22	80%	99%	99%

- Si le condensateur est trop dégradé, pas de progrès
 - Aucun benchmark complété
 - Principalement de la réexécution
- En réalité, pas notre principal problème

	Benchmarks exécutés (moyenne)		
Capacité(μ F)	aes	crc	rc4
105	26	61	34
75	30	61	38
42	0	73	7
22	0	0	0

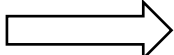
	Pourcentage de réexécution		
Capacité(μ F)	aes	crc	rc4
105	0%	0%	0%
75	0%	0%	0%
42	96%	0%	95%
22	80%	99%	99%

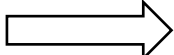
- Si le condensateur est trop dégradé, pas de progrès
 - Aucun benchmark complété
 - Principalement de la réexécution
- En réalité, pas notre principal problème: par moment, on récupèrera suffisamment d'énergie pour s'exécuter en continu

	Benchmarks exécutés (moyenne)		
Capacité(μ F)	aes	crc	rc4
105	26	61	34
75	30	61	38
42	0	73	7
22	0	0	0

	Pourcentage de réexécution		
Capacité(μ F)	aes	crc	rc4
105	0%	0%	0%
75	0%	0%	0%
42	96%	0%	95%
22	80%	99%	99%

- Si le condensateur est trop dégradé, pas de progrès
 - Aucun benchmark complété
 - Principalement de la réexécution
- En réalité, pas notre principal problème: par moment, on récupèrera suffisamment d'énergie pour s'exécuter en continu
- Problème : la corruption mémoire.

Accès mémoire VM et NVM + ré-exécution  corruption mémoire

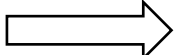
Accès mémoire VM et NVM + ré-exécution  corruption mémoire

```
int array[2];  
int i = 0;  
while(i<2) {  
    checkpoint();  
    array[i] = 0;  
    i++;  
}
```

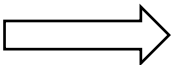
Accès mémoire VM et NVM $\oplus$ ré-exécution $\Rightarrow$ corruption mémoire

```
int array[2];  
int i = 0;  
while(i<2) {  
    checkpoint();  
    array[i] = 0;  
    i++;  
}
```

Avec i en NVM

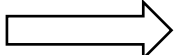
Accès mémoire VM et NVM + ré-exécution  corruption mémoire

```
int array[2];  
int i = 0;  
while(i<2) {  
    checkpoint();  
    array[i] = 0;  
    i++;  
}
```

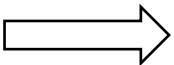

Exécution
Intermittente

```
array[0] = 0  
i++  
checkpoint()  
array[1] = 0  
i++
```

Avec i en NVM

Accès mémoire VM et NVM + ré-exécution  corruption mémoire

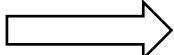
```
int array[2];  
int i = 0;  
while(i<2) {  
    checkpoint();  
    array[i] = 0;  
    i++;  
}
```


Exécution
Intermittente

```
array[0] = 0  
i++  
checkpoint()  
array[1] = 0  
i++  

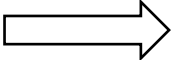
```

Avec i en NVM

Accès mémoire VM et NVM + ré-exécution  corruption mémoire

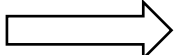
```
int array[2];  
int i = 0;  
while(i<2) {  
    checkpoint();  
    array[i] = 0;  
    i++;  
}
```

Avec i en NVM


Exécution
Intermittente

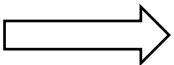
```
array[0] = 0  
i++  
checkpoint()  
array[1] = 0  
i++  
  
array[2] = 0 
```

Accès out of bound
= corruption mémoire

Accès mémoire VM et NVM + ré-exécution  corruption mémoire

```
int array[2];  
int i = 0;  
while(i<2) {  
    checkpoint();  
    array[i] = 0;  
    i++;  
}
```

Avec i en NVM


Exécution
Intermittente

```
array[0] = 0  
i++  
checkpoint()  
array[1] = 0  
i++  
  
array[2] = 0 
```

Accès out of bound
= corruption mémoire

Une seule réexécution peut corrompre tout le système !

Accès mémoire VM et NVM + ré-exécution $\longrightarrow$ corruption mémoire

```
int array[2];
int i = 0;
while(i<2) {
    checkpoint();
    array[i] = 0;
    i++;
}
```

Avec i en NVM

$\longrightarrow$
Exécution
Intermittente

```
array[0] = 0
i++
checkpoint()
array[1] = 0
i++
⚡
array[2] = 0 ⚠
```

Accès out of bound
= corruption mémoire

Une seule réexécution peut corrompre tout le système !

Certaines approches “pire cas” garantissent l’absence de réexécution en se basant sur la taille du condensateur

Accès mémoire VM et NVM + ré-exécution $\longrightarrow$ corruption mémoire

```
int array[2];
int i = 0;
while(i<2) {
    checkpoint();
    array[i] = 0;
    i++;
}
```

Avec i en NVM

$\longrightarrow$
Exécution
Intermittente

```
array[0] = 0
i++
checkpoint()
array[1] = 0
i++
⚡ array[2] = 0 ⚠
```

Accès out of bound
= corruption mémoire

Une seule réexécution peut corrompre tout le système !

Certaines approches “pire cas” garantissent l’absence de réexécution en se basant sur la taille du condensateur $\longrightarrow$ Sa dégradation casse ces garanties

	Apparition d'une ré-exécution (sur 50 expériences)		
Capacité(μ F)	aes	crc	rc4
105	0	0	0
75	0	0	0
42	50	0	50
22	50	50	50

- La dégradation du condensateur entraine des réexécutions

	Apparition d'une ré-exécution (sur 50 expériences)		
Capacité(μ F)	aes	crc	rc4
105	0	0	0
75	0	0	0
42	50	0	50
22	50	50	50

- La dégradation du condensateur entraine des réexécutions
- Ces réexécutions peuvent entrainer des anomalies mémoires

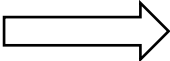
	Apparition d'une ré-exécution (sur 50 expériences)		
Capacité(μ F)	aes	crc	rc4
105	0	0	0
75	0	0	0
42	50	0	50
22	50	50	50

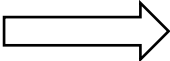
- La dégradation du condensateur entraine des réexécutions
- Ces réexécutions peuvent entrainer des anomalies mémoires
 - Meilleur cas : Capteur HS
 - Pire cas : Mesures corrompues/érronées, comportements nuisibles

	Apparition d'une ré-exécution (sur 50 expériences)		
Capacité(μ F)	aes	crc	rc4
105	0	0	0
75	0	0	0
42	50	0	50
22	50	50	50

- La dégradation du condensateur entraine des réexécutions
- Ces réexécutions peuvent entrainer des anomalies mémoires
 - Meilleur cas : Capteur HS
 - Pire cas : Mesures corrompues/erronées, comportements nuisibles
- Effets dommageables et irréversibles sur le réseau de capteur

- Autonomie “infinie” ?
- Fonctionnement des capteurs sans batteries impacté par
 - Conditions opératoires (température, humidité)
 - Vieillessement des composants matériels

- Autonomie “infinie” ?
- Fonctionnement des capteurs sans batteries impacté par
 - Conditions opératoires (température, humidité)
 - Vieillesse des composants matériels
- Dégradation du condensateur  Absence de progrès, Anomalies mémoire
- Avec une dégradation de 60%, possibilité d'effets irréversibles
- Nécessité d'intervention manuelle

- Autonomie “infinie” ?
- Fonctionnement des capteurs sans batteries impacté par
 - Conditions opératoires (température, humidité)
 - Vieillissement des composants matériels
- Dégradation du condensateur  Absence de progrès, Anomalies mémoire
- Avec une dégradation de 60%, possibilité d'effets irréversibles
- Nécessité d'intervention manuelle

Autonomie menacée par la dégradation des composants

- Comment détecter la dégradation du condensateur ?
- Comment s'adapter aux dégradations du condensateur ?
- Focus : Condensateur
 - Est-ce le composant le plus faillible ?
 - Analyse des autres composants
- Quelle est la durée de vie d'un capteur sans batterie ?

Merci de votre attention
Avez-vous des questions ?

- Durée de vie “utile” d’un condensateur conditions standard

- ≈ 1 an à 40° (8 000h)
- ≈ 3 ans à 25° (25 000h)

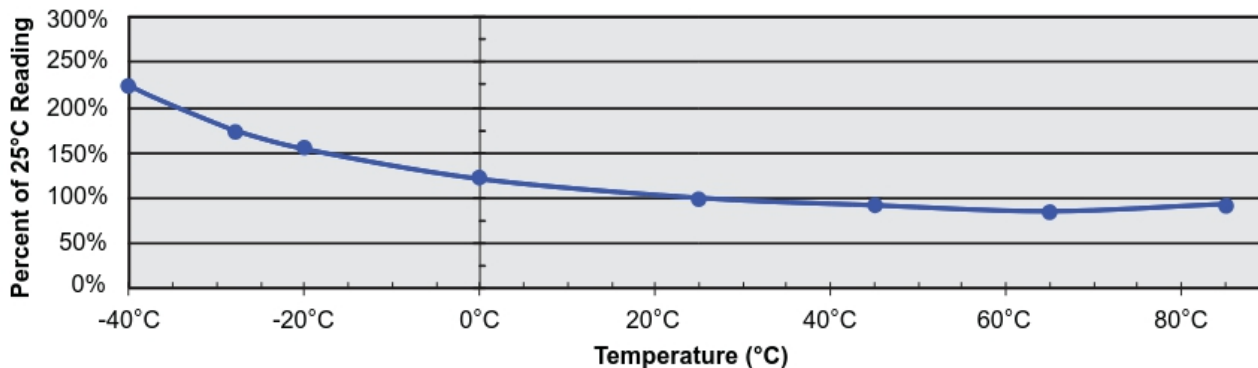
Définition de la durée de vie utile

$$\Delta C/C: \pm 30 \%$$

$$R_l \leq 4 \times \text{spec. limit}$$

$$I_L \leq 2 \times \text{spec. limit}$$

Equivalent Series Resistance vs. Temperature



Sources :

“196DLC series - Energy Storage Double Layer Capacitors” datasheet, Vishay Components, rev 2018

“SCM series - Series-Connected SuperCapacitor Modules” datasheet, AVX